

Spektrometr EDXRF Model EDX 6000B



Spektrometr EDX 6000B wykorzystuje nieniszczącą technologię XRF do szybkiej i dokładnej analizy próbek mineralnych i stopów metali. Analizator posiada lampę rentgenowską o niskiej energii zapewniającą wysoki poziom wzbudzenia pierwiastków lekkich jak Si, S czy Mg, a także krótki czas analizy i wysoką sprawność pomiarów. Detektor SDD o wysokiej czułości gwarantuje wysoki poziom liniowości energii, dobrą rozdzielczość energii, dobre właściwości widma i wysoki stosunek piku do szumu. Technika rozdziału widma zwiększa dokładność równoczesnej analizy lekkich pierwiastków.

Cechy produktu

- Urządzenie zapewnia profesjonalną analizę pierwiastkową cementu, stopów metali, próbek mineralnych i glebowych, a także pomiary grubości powłok i analizy zgodności z dyrektywą RoHS/WEEE.
- Wbudowany wzmacniacz sygnału względem zakłóceń zwiększa zdolność obliczeniową do 25 razy.
- Zestaw filtrów i kolimatorów przełączany automatycznie dla różnych typów próbek.
- Chłodzony elektrycznie detektor SDD o wysokiej rozdzielczości zamiast detektora chłodzonego LN2.
- Oprogramowanie analityczne w języku polskim z elementami analizy FP (Fundamental Parameters) do pełnych analiz pierwiastkowych ilościowych, półilościowych i jakościowych. Posiada możliwość rozbudowy istniejących i tworzenia własnych bibliotek widm referencyjnych.
- Pełne bezpieczeństwo pracy użytkownika. Komora pomiarowa spektrometru jest wyposażona w dwuwarstwową pokrywę z płyty ołowianej oraz automatyczny wyłącznik lampy w przypadku prób otwarcia pokrywy w trakcie trwania pomiaru.
- Precyzyjny system wyboru punktu pomiarowego z kamerą CCD o wysokiej rozdzielczości.
- Pojemna próżniowa komora pomiarowa niweluje wpływ czynników atmosferycznych i znacznie zwiększa dokładność pomiarów małych i cienkich próbek.
- Atmosfera pracy do wyboru: powietrze dla pomiarów standardowych lub próżnia do oznaczania niskich zawartości pierwiastków lekkich.
- Wymiary komory po wyjęciu podajnika próbek: $\Phi 260\text{mm} \times 38\text{mm}$.



Specyfikacja techniczna EDX 6000B

Model	EDX 6000B, profesjonalny spektrometr EDXRF do analiz pierwiastkowych
Detektor	SDD chłodzony termoelektrycznie o wysokiej rozdzielczości energii
Rozdzielczość energii	145 +/- 5 eV
Źródło wzbudzenia	lampa rentgenowska z oknem typu end-window, z anodą Rh
Moc lampy	50 W z napięciem regulowanym do max. 50 kV
Prąd lampy	1– 1000 μ A
Czas analizy	60-200 sekund (pierwsze wyniki już po 10 sekundach)
Mierzone pierwiastki	od Na (sodu) do U (uranu)
Jednoczesna analiza	do 24 pierwiastków
Zakres pomiarowy	1 ppm – 99,99%
Stabilność pomiaru	0,05% (zawartość powyżej 96%)
Formy próbek	ciała stałe, ciecze, proszki z uwzględnieniem prób higroskopijnych
Pomiar powłok	max do 11 warstw, max grubość powłoki do 0,005 μ m
Pozycjonowanie próby	Kamera CCD 1,4 mln pix.
Komora pomiarowa	Pojemna komora pomiarowa Φ 260mm x 38mm z systemem próżniowym dla optymalizacji wyników. Automatyczny podajnik na 7 lub 10 prób (opcja).
Filtry	Wbudowany zmieniacz 6 filtrów do optymalizacji wzbudzenia
Zabezpieczenia	Potrójny system zabezpieczeń przed promieniowaniem.
Zasilanie	110/220 VAC +/- 5V (zalecane źródło stabilizowane)
Warunki robocze	Temperatura: + 15 °C to + 30 °C, wilgotność: 35% - 70%
Pobór mocy	100 W –spektrometr, 370 W – pompa próżniowa
Poziom hałasu	60 db
Konfiguracja standardowa	Detektor SDD, wzmacniacz sygnału do zakłóceń (SNE), system optymalizacji ścieżki świetlnej, wbudowana kamera CCD, wbudowany zmieniacz 6 filtrów, oprogramowanie analityczne FP w języku polskim, zasilanie nisko- i wysokonapięciowe, zestaw komputerowy w wybranej przez klienta konfiguracji.

Zastrzegamy możliwość zmian specyfikacji bez uprzedniej informacji

Dystrybutor firma EnviSense posiada zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Atomowe Nr D-18077 z dn. 02-03-2012 z aneksem z dnia 28-03-2014.

